



OMICRON

OMICRON Test Universe

Novedades de la versión 4.30



Novedades de Test Universe 4.30

Versión del manual: Novedades de *Test Universe* 4.30 — Idioma: ESP — Año: 2021

© OMICRON electronics. Todos los derechos reservados.

Este manual es una publicación de OMICRON electronics.

Reservados todos los derechos, traducción incluida. Para la reproducción de todo tipo, por ejemplo, fotocopia, microfilmación, reconocimiento óptico de caracteres y/o almacenamiento en sistemas informáticos, es necesario el consentimiento explícito de OMICRON electronics. No está permitida la reimpresión total o parcial.

La información, especificaciones y datos técnicos del producto que figuran en este manual representan el estado técnico existente en el momento de su redacción y están supeditados a cambios sin previo aviso.

OMICRON electronics traduce este manual de su idioma original inglés a otros idiomas. Cada traducción de este manual se realiza de acuerdo con los requisitos locales, y en el caso de discrepancia entre la versión inglesa y una versión no inglesa, prevalecerá la versión inglesa del manual.

Índice

1	Introducción	4
2	Nuevas funciones	5
2.1	Nueva pantalla de inicio de Test Universe	5
2.2	Evaluación automática mejorada	5
2.3	Nueva configuración de Sampled Values	6
2.4	Nuevas opciones para realizar pruebas con el módulo cliente-servidor IEC 61850	6
2.5	Plantillas PQ actualizadas	7
3	Cambios, mejoras y correcciones de errores	8
	Asistencia	10

1 Introducción

Test Universe 4.30 es una actualización importante del software.

Test Universe 4.30 puede trabajar con archivos de prueba creados con versiones anteriores de *Test Universe*, pero los archivos creados/editados con *Test Universe* 4.30 no se pueden abrir con versiones anteriores.

Las principales novedades se enumeran en el capítulo **2. Nuevas funciones**. Otros cambios, mejoras y correcciones de errores se enumeran en el capítulo **3. Cambios, mejoras y correcciones**.

2 Nuevas funciones

2.1 Nueva pantalla de inicio de Test Universe

La pantalla de inicio de *Test Universe* se ha rediseñado para simplificar el acceso a los documentos de prueba del OMICRON *Control Center* (OCC), a la *Biblioteca de pruebas de protección* (PTL) y a los módulos de prueba más utilizados.

La nueva pantalla de inicio de *Test Universe* consta de cuatro botones principales:

- **Documento de prueba nuevo**
Crea nuevos documentos de prueba de *Control Center* (documentos OCC).
- **Abrir documento de prueba**
Abre los documentos de prueba de *Control Center* (documentos OCC) existentes.
- **Módulos de prueba y herramientas**
Da acceso a los módulos de prueba y a las herramientas. Se organiza en una estructura similar a la de la pantalla de inicio anterior.
- **Configuración y soporte**
Da acceso a la sección de configuración y soporte.

Otras nuevas características:

- **Favoritos** definibles por el usuario para acceder rápidamente a los módulos de prueba y las herramientas que más se utilizan.
- Acceso directo a los documentos de prueba utilizados recientemente.

2.2 Evaluación automática mejorada

La evaluación automática en *Control Center* ofrece una rápida vista general de los resultados de las pruebas. Sin embargo, en algunos casos, las pruebas de los módulos se evaluaban como **correctas** aunque el resultado debía ser verificado por el ingeniero de pruebas una vez más.

- Estado de la prueba **"Ejecutada, evaluación pendiente"**
El módulo ha ejecutado completamente todos los pasos de la prueba, pero no se ha podido realizar una evaluación automática porque no se ha definido ningún criterio de evaluación.

Esta nueva evaluación está disponible para *Advanced TransPlay*, *Ramping*, *Pulse Ramping*, *State Sequencer*, *PQ Signal Generator* e *IEC 61850 Client/Server*.

Novedades de Test Universe 4.30

- Estado de la prueba "**Correcta, parcialmente ejecutada**"
El módulo ha ejecutado por completo todos los pasos de prueba que podían ejecutarse y los ha evaluado como **correctos**. Sin embargo, al menos uno de los pasos o puntos de prueba definidos no ha podido ser ejecutado. Normalmente, esto ocurre cuando un paso o punto de prueba está fuera de rango.

Esta nueva evaluación está disponible para *Distance* y *Advanced Distance*, *Power* y *Advanced Power* y *Overcurrent*
- La ejecución de la prueba se bloquea cuando no se definen puntos de prueba válidos.
No se puede iniciar una prueba cuando no se han definido puntos de prueba válidos. En este caso, la opción **Comenzar/Continuar** de la pestaña **Inicio** siempre habrá estado desactivada. Novedad en este contexto:
 - Las pruebas que se van a ejecutar desde *Control Center* ahora permanecen en el estado de prueba **En reposo**.
 - El historial de estado de *Control Center* mostrará un mensaje de estado **No se pudo realizar la prueba: No se han definido puntos de prueba válidos**.Esto se aplica a los módulos de prueba *Advanced Distance*, *Overcurrent*, *Power* y *Advanced Power*, y *Distance*.

2.3 Nueva configuración de Sampled Values

Se atiende a las nuevas incorporaciones y características de IEC 61869-9 e IEC 61850-9-2 Ed2.1:

- Datasets configurables: El contenido del dataset Sampled Values (SV) es configurable; puede contener hasta 32 valores.
- Se pueden configurar los campos opcionales más frecuentes.
- La salida de SV es independiente de la salida de los valores analógicos.
- Con el software *Test Universe*, un CMC puede generar hasta 3 flujos de SV, independientemente de si la opción LLO-2 está presente o no.
- La revisión de la configuración (ConfRev) y el signo de los valores de secuencia residual/homopolar pueden ajustarse.

Nota: Se necesita una interfaz NET-2 para hacer uso de estas nuevas funciones. Como alternativa, se puede seguir utilizando la forma anterior (TU 4.20 y anteriores) de generar los SV.

2.4 Nuevas opciones para realizar pruebas con el módulo cliente-servidor IEC 61850

- Se ha añadido soporte para las salidas binarias virtuales.
- Admite los servicios de control definidos en IEC 61850.

2.5 Plantillas PQ actualizadas

- Corrección de imprecisiones menores, por ejemplo, se ha optimizado la sincronización para las pruebas de medición de parpadeo durante un caso de saltos de fase.
- La facilidad de uso general se ha mejorado, por ejemplo, mediante la reelaboración de los diálogos del programa y una estructura adaptada de algunas plantillas.
- En general, se ha mejorado el procedimiento de prueba mediante la optimización de los tiempos de prueba (tiempos previos, simultáneos y posteriores al incidente).
- El manual del usuario se ha actualizado para reflejar los cambios recientes en las plantillas de pruebas.

3 Cambios, mejoras y correcciones de errores

- *Advanced Distance*: Se ha añadido el soporte de entradas y salidas binarias virtuales.
- **Configuración del hardware**: Las salidas analógicas se organizan ahora en sistemas de tensión y corriente. Dependiendo del número de sistemas de salida seleccionados, se dispone de configuraciones más detalladas en el cuadro de diálogo de configuración del dispositivo.
- *QuickCMC*: El botón "Comenzar" quedaba desactivado si QuickCMC estaba incrustado en OCC con el nivel de protección "Cambios sólo con script" o "Ningún cambio". Esto se ha solucionado ahora y el botón "Comenzar" está desactivado sólo para el nivel de protección "Sólo ver/imprimir".
- *Control Center*: Al utilizar Windows 10, el gráfico del diagrama fasorial del informe no se exportaba a RTF. Ahora esto se ha resuelto.
- *Control Center*: Cuando un módulo parcialmente ejecutado se evaluaba manualmente como "Incorrecta", el contador de los módulos evaluados manualmente no se actualizaba. Ahora esto se ha resuelto.
- *Ramping*: (Problema notificado por los clientes) Las nuevas entradas de los nombres de evaluación no se actualizaban en la vista de evaluaciones calculadas. Ahora esto se ha resuelto.
- Módulos de prueba de *Differential*: "Añadir barrido": El último punto a veces no se añade a la tabla de puntos de prueba. Ahora esto se ha resuelto.
- Interfaz de automatización: Las constantes de OCC para los idiomas checo, indonesio, coreano, eslovaco y turco están ahora documentadas en la Ayuda.
- *Overcurrent*: (Problema notificado por el cliente) Las características exportadas desde *O/C Characteristic Grabber* de una versión anterior de *Test Universe* ya no pueden importarse en *Overcurrent*. Ahora esto se ha resuelto.
- *Overcurrent*: En la elaboración de informes, la magnitud de la corriente de un disparo tenía un hueco entre el multiplicador y la unidad, que podía causar problemas de diseño en los informes exportados. Ahora esto se ha resuelto.
- *Overcurrent/QuickCMC*: Los documentos de prueba con demasiadas condiciones de trigger (entradas binarias) no podían ejecutarse a veces. Ahora esto se ha resuelto.
- *EnerLyzer*: Problema notificado por los clientes "En *Test Universe* 4.20, ya no era posible seleccionar la ruta para guardar en el Registro de tendencias". Ahora esto se ha resuelto.
- Instalación: *ADMO* se ha trasladado de la configuración de *Test Universe* al DVD del software complementario.
- *Sampled Values Configuration*: El módulo ya no se iniciará en modo fuera de línea si un flujo de Sampled Values, configurado fuera de *Test Universe*, ya está activo en el equipo de prueba conectado.
- *IEC 61850 Client/Server*: Los botones "Añadir" y "Eliminar" para los DataObjects en el estado "Ajustar IED" a veces permanecen desactivados después de despejar los resultados de las pruebas. Ahora esto se ha resuelto.
- *IEC 61850 Client/Server*: Se muestra un mensaje de error correcto en el monitor C/S si falla la verificación de DO "Beh".

Cambios, mejoras y correcciones de errores

- *Advanced TransPlay*: El campo "Número de evaluación" de la oscilografía se ha cambiado a "Ciclo de prueba".
- Instalación: Se ha eliminado "Foxit Reader" de la configuración de *Test Universe*.
- XRIO: Un nuevo filtro de importación para los ajustes de SEL Grid Configurator (archivo csv) está ahora disponible.
- XRIO: Un nuevo filtro de importación para los ajustes de NR PCS-Studio (archivo csv) está ahora disponible.
- La versión de *TransView* se ha actualizado a la versión 4.61 SR1.

Asistencia

Queremos que cuando trabaje con nuestros productos saque el mayor provecho posible. Si necesita asistencia, nosotros se la prestaremos.

Asistencia técnica permanente – Obtenga asistencia



www.omicronenergy.com/support

En nuestra línea directa de asistencia técnica, se pondrá en contacto con técnicos altamente cualificados a los que plantear sus dudas. A cualquier hora del día y de forma gratuita.

Utilice nuestra línea directa de asistencia técnica internacional disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

América: +1 713 830-4660 o +1 800-OMICRON

Asia-Pacífico: +852 3767 5500

Europa / Oriente Medio / África: +43 59495 4444

Adicionalmente, puede buscar el OMICRON Service Center o OMICRON Sales Partner más cercano a usted en www.omicronenergy.com → Contactar.

Portal de clientes – Manténgase informado



www.omicronenergy.com/customer

El **Portal de clientes** de nuestro sitio web es una plataforma internacional de intercambio de conocimientos. Descargue las últimas actualizaciones de software para todos los productos y comparta sus experiencias en nuestro foro de usuarios.

Consulte nuestra **Biblioteca de conocimientos** en la que encontrará notas de aplicación, ponencias de conferencias, artículos sobre experiencias en el trabajo diario, manuales de usuario y mucho más.

OMICRON Academy – Aprenda más



www.omicronenergy.com/academy

Aprenda más acerca de nuestros productos en uno de los cursos de capacitación que ofrece la **OMICRON Academy**.

OMICRON electronics GmbH, Oberes Ried 1, 6833 Klaus, Austria. +43 59495.